

**Renishaw tillkännager lanseringen av metrologiprogramvaran MODUS 2™**

Renishaw är stolta att presentera lanseringen av metrologiprogrampaketet MODUS 2, en ny nivå av enkelhet och effektivitet för programmering och användning av CMM-maskiner.

MODUS 2 är baserad på den etablerade och högpresterande MODUS-plattformen, stödjer Renishaws 3- och 5-axliga CMM-sensorteknologier och är framtagen med tanke på användarvänligheten. Det innovativa gränssnittet är enkelt för nya användare att lära sig, och även snabbare att programmera, vilket ger en oöverträffad produktivitet med eller utan en CAD-modell.

Användarens upplevelse är skapad för att vara identisk oavsett om mjukvaran är kopplad till en CMM i produktionen eller används i en ”offline-miljö” där en full simulering med hastighetskontroll möjliggör mätsekvensutveckling och visualisering.

En fullständig omdesign av programvarans gränssnitt med införandet av "Off Surface"-rörelseteknologi, intelligenta mätningsstrategier, automatisk rapportering och en interaktiv virtuell CMM-miljö är bara några av de innovationer som förbättrar användarens upplevelse. Från enkel manuell CMM-användning till komplex detaljmätning på fleraxliga system anpassas MODUS 2 automatiskt och erbjuder bara funktioner som är relevanta för den aktuella uppgiften.

Intelligent hämtning av CAD-data och kunskap om den underliggande geometrin avgör mätningsstrategin. Dock är konsekventa mätmetoder avgörande i en organisation, och MODUS 2 underlättar detta genom att låta användarna samarbeta om datainsamlingsegenskaper och parametrar såsom detaljinpassningsalgoritmer och filter.

Från 5:e till 10:e oktober 2015 på EMO 2015 kan besökare se det nya metrologipaketet MODUS 2 demonstreras av Renishaw i Hall 5, monter D15.

Ytterligare information finns på vår webbplats www.renishaw.se/cmm.

-Slut-